

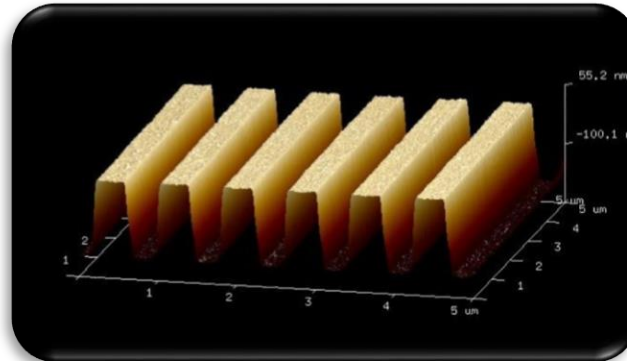
# WAFER BONDING - MATERIAL

## Projektteam:

- Laurin Huber
- Marco Offenzeller

## Aufgabenstellung:

- Bei beidseitig strukturierten Wafern ist eine Schutzschicht auf einer Seite erforderlich, um Veränderungen oder Zerstörung während des Messvorgangs zu verhindern.
- Zwei potenzielle Materialien sollen als Schutzschicht getestet werden.



Graphik einer AFM gemessenen Nanometerstruktur

## Endergebnis:

- Mit den beiden Tests der acetonlöslichen Schutzlacke wird ein positives Ergebnis erzielt. Sowohl auf Harz 1, sowie auf Harz 2 können keine großen Unterschiede der Struktur vor und nach dem Auftragen des Schutzlacks festgestellt werden. Keine Veränderung oder Beschädigung der Struktur, der Rauigkeit oder der Tiefe der Struktur.
- Mit den beiden Tests der wasserlöslichen Schutzlack können keine positiven Ergebnisse erzielt werden. Weder auf Harz 1 noch auf Harz 2. Hier kommt es vermehrt zu einer Veränderung oder Beschädigung der Struktur, der Rauigkeit oder zu Rückständen zwischen den Strukturen.

## **Projektbetreuer:**

- DI Dominik Treiblmayr – EVG
- DI Klemens Tremel – Andorf Technology School